Создание и свойства гетероструктур In₂O₃/CdS/CuInSe₂

© В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь*

Санкт-Петербургский государственный технический университет, 195251 Санкт-Петербург, Россия *Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 21 декабря 1998 г. Принята к печати 23 декабря 1998 г.)

Вакуумным термическим напылением слоев CdS $\langle In \rangle$ на нагретые подложки *p*-CuInSe₂ получены гетероструктуры, на широкозонную компоненту которых методом магнетронного распыления наносился слой In₂O₃. Исследована фоточувствительность гетероструктур в естественном и линейно поляризованном излучении. Фоточувствительность лучших структур дотигает 80 мA/Вт при T = 300 K. Обнаружена наведенная поляризационная фоточувствительность гетероструктур и обсуждаются закономерности ее угловых и спектральных зависимостей. Сделаны выводы о возможностях использования полученных гетероструктур в качестве узкоселективных фотоанализаторов линейно поляризованного излучения.

Тройные полупроводники $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$ с решеткой халькопирита находят все более широкое распространение в разработках высокоэффективных фотопреобразователей разнообразных типов [1–3]. Барьер CdS/CuInSe₂ уже позволил довести коэффициент полезного действия солнечных элементов до 18% [4]. В данной работе изложены результаты первых исследований поляризационной фоточувствительности (ФЧ) таких гетероструктур (ГС), снабженных антиотражающим покрытием In₂O₃.

Для изготовления ГС применялись поликристаллические слитки CuInSe₂, полученные непосредственным сплавлением исходных элементов чистотой не ниже 99.999 вес %. Синтез осуществлялся в вакуумированных кварцевых ампулах и за счет введения в состав шихты избыточного селена обеспечивал получение электрически однородного вещества с концентрацией свободных дырок около $2 \cdot 10^{16}$ см⁻³ и холловской подвижностью $25 \text{ см}^2/\text{B} \cdot \text{с}$ при T = 300 К. Параметры элементарной ячейки выращенных кристаллов соответствовали известным для CuInSe₂ [4].

Полученные плотные слитки CuInSe₂ (длина до 10 см, диаметр до 12 мм) разрезались на шайбы, поверхность которых полировалась механически, а затем химически, тщательно промывалась и просушивалась. Слои сульфида кадмия осаждались вакуумным термическим распылением порошкообразного вещества, представляющего собой смесь CdS и InS, взятых в соотвествующем соотношении. Осаждение слоев проводилось на нагретые (400-450°С) подложки CuInSe₂. Это обеспечивает получение слоев CdS с концентрацией свободных электронов от 10¹⁸ до 10¹⁹ см⁻³ при толщинах 3-4 мкм. Достигнутый уровень легирования слоев связан с растворением индия в CdS. Методом магнетронного распыления мишени из чистого индия в кислородсодержащей атмосфере на поверхность CdS осаждались слои In₂O₃ с толщинами около 1 мкм. Затем на поверхность In₂O₃ вакуумным напылением наносилась токосъемная гребенка из Ац, а на тыльную поверхность шайб наносился сплошной слой Аи толщиной до 2 мкм. Активная площадь полученных ГС достигала 1–1.2 см².

На рис. 1 приведена типичная стационарная вольтамперная характеристика одной из полученных ГС, пропускное направление всегда отвечало положительной полярности внешнего смещения на p-CuInSe₂. Прямая ветвь вольт-амперных характеристик при U > 1 В следует соотношению

$$I = (U - U_0)/R_0,$$
 (1)

где R_0 — остаточное сопротивление, а U_0 — напряжение отсечки. Для исследованных ГС $R_0 = 200-500$ Ом, а $U_0 = 0.8$ В при T = 300 К. Обратный ток таких ГС растет пропорциоанально напряжению до 1 В, а при U > 1 В наступает мягкий пробой.

При освещении ГС со стороны In_2O_3 возникает фотовольтаический эффект, причем положительная полярность фотонапряжения отвечает *p*-CuInSe₂, что находится в соответствии с направлением выпрямления. Для лучших ГС вольтовая фоточувствительность достигает 10 В/Вт, а токовая — 80 мА/Вт при T = 300 К.

На рис. 2 представлены типичные спектральные зависимости относительной квантовой эффективности фотопреобразования η для некоторых ГС в естественном излучении при T = 300 К. Длинноволновый край ФЧ для всех ГС экспоненциальный и ему отвечает высокая крутизна $s = \partial (\ln \eta) / \partial (\hbar \omega)$, которая в полученных ГС изменяется в диапазоне $60-120 \ \mathrm{yB}^{-1}$, что соответствует характеру межзонных переходов в CuInSe₂ [5]. Энергетическое положение длинноволнового края фоточувствительности η для исследованных структур лежит в окрестности ширины запрещенной зоны E_G CuInSe₂ и может быть сопоставлено прямым межзонным переходам в этом полупроводнике [6]. Однако спектральный контур коротковолнового спада $\Phi \Psi$ ($\hbar \omega > E_G$) в полученных ГС сильно различается (рис. 2, кривые 1-4), что приводит к изменениям полной ширины спектральных полос η на их полувысоте $\delta_{1/2}$ от 20 до 400 мэВ в разных ГС. Для гетероструктур с наиболее широкополосным спектром ФЧ (рис. 2, кривая 4) энергетическое положение абсолютного максимума $\hbar \omega_m$ совпадает с E_G CuInSe₂ [4].



Рис. 1. Стационарная вольт-амперная характеристика гетероструктуры $In_2O_3/CdS/CuInSe_2$ при T = 300 К. Положительный потенциал внешнего смещения отвечает CuInSe₂.

По мере усиления коротковолнового спада η и соответствующего этому снижению $\delta_{1/2}$ абсолютный максимум ФЧ смещается в сторону длинных волн. Обращает на себя внимание тот факт, что как только $\hbar\omega_m$ становится ниже E_G CuInSe₂, коротковолновый спад η становится практически экспоненциальным вплоть до близких к E_G энергий фотонов (рис. 2, кривые 1–3). С учетом того что геометрические параметры широкозонных компонент в исследованных ГС были близкими, есть основания связывать резкий коротковолновый спад η с преимущественной локализацией активной области ГС в CuInSe₂ вследствие различий в уровнях легирования подложек и слоев CdS $\langle In \rangle$. Для приведенных на рис. 2 спектров η как раз и наблюдается ослабление коротковолнового спада

фоточувствительности по мере снижения концентрации электронов в слоях $CdS\langle In \rangle$.

При освещении линейно поляризованным излучением вдоль нормали к фронтальной плоскости ГС In_2O_3 (угол падения $\Theta = 0^\circ$) ФЧ всех полученных ГС не зависит от положения вектора электрического поля световой волны относительно плоскости падения излучения во всей области фоточувствительности (рис. 3). Это обстоятельство определяется поликристалличностью подложек и слоев *n*-CdS, которая замывает естественный фотоплеохроизм полупроводников [5]. В условиях $\Theta > 0^\circ$ возникает различие в значениях фототоков для *p* и *s*-поляризаций $i^p > i^s$ (рис. 3, кривые 1, 1' и 2, 2'). Вследствие этого во всей области ФЧ коэффициент наведенного фотоплеохроизма

$$P_{I} = (i^{P} - i^{S}) / (i^{P} + i^{S})$$
(2)

становится отличным от нуля. Зависимость P_I от угла падения Θ в исследованных гетероструктурах характе-



Рис. 2. Спектральные зависимости относительной квантовой эффективности фотопреобразования гетероструктур $In_2O_3/CdS/CuInSe_2$ при T = 300 К. Номера образцов: I - 6, 2 - 1, 3 - 7, 4 - 10-1. Освещение неполяризованным излучением со стороны In_2O_3 . Концентрация электронов в слоях CdS при T = 300 К $n \cdot 10^{-19}$, см⁻³: I - 2, 2 - 0.8, 3 - 0.5, 4 - 0.15.

Физика и техника полупроводников, 1999, том 33, вып. 7



Рис. 3. Зависимости фототоков $(1, 1' - i^p, 2, 2' - i^s)$ и коэффициента наведенного фотоплеохроизма (3, 4) от угла падения линейно поляризованного излучения для гетероструктуры In₂O₃/CdS/CuInSe₂ при T = 300 К. (Образец 7. λ , мкм: I, 2, 3 - 1.160, 1', 2', 4 - 0.994).

ризуется квадратичным законом $P_I \sim \Theta^2$ во всей области ФЧ (рис. 3, кривые 3 и 4), что соответствует [7] и позволяет плавно контролировать величину P_I посредством изменения Θ .

На рис. 4 приведены типичные спектральные зависимости коэффициента наведенного фотоплеохроизма для нескольких ГС. Как следует из этого рисунка, коэффициент наведенного фотоплеохроизма в таких структурах может обнаруживать осцилляции или оставаться постоянным. Сам факт наличия осцилляций и изменений величины P_1 среди исследованных ГС с одной и той же границей воздух/In₂O₃, через которую излучение поступает в активную область ГС, находится в противоречии с анализом [7]. Оценка коэффициента наведенного фотоплеохроизма на основании [7] и показателя преломления n = 2.14 для In₂O₃ [8] в таких структурах приводит к величине 36–38 % ($\Theta = 75^{\circ}$). Экспериментальные

3* Физика и техника полупроводников, 1999, том 33, вып. 7

значения P_I приближаются к этому пределу только в длинноволновой области и для некоторых из полученных структур (рис. 4). Аналогичные особенности наблюдались ранее в других типах ГС и объяснены интерференционными явлениями [3,9–12]. По-видимому, и для исследованных в данной работе ГС естественно связать возникновение осцилляций фотоплеохроизма с интерференцией излучения в слоях In_2O_3 . Различия в амплитуде осцилляций и энергетическом положении экстремумов P_I (рис. 4) в таком случае указывают на колебания в параметрах просветляющих слоев в таких ГС.

Важно подчеркнуть, что только в области энергий, отвечающих максимумам P_I, угловые зависимости фототоков находятся в качественном соответствии с результатами анализа процесса прохождения световой волной границы раздела двух сред на основании соотношений Френеля [13,14]. В этом случае фототок *i^p* с ростом Θ вначале возрастает, проходит через максимум в окрестности псевдобрюстеровского угла и только затем спадает, тогда как is монотонно падает с увеличением угла падения (рис. 3, кривые 1 и 1'). Проявляющееся увеличение i^p характеризует слои In_2O_3 как достаточно совершенные и свидетельствует о снижении потерь на отражение *p*-волны. Обнаруженные различия в угловых зависимостях фототоков приводят к тому, что их поляризационная разность $\Delta i = i^p - i^s$, а следовательно, и сам коэффициент Р₁ достигают своего максимального значения.

С удалением энергии падающих фотонов от точки, отвечающей максимуму в спектрах *P*_I (рис. 4, кри-



Рис. 4. Спектральные зависимости коэффициента наведенного фотоплеохроизма гетероструктур $In_2O_3/CdS/CuInSe_2$ при T = 300 K. Номера образцов: 1 - 7, 2 - 3, 3 - 10-1. $\Theta = 75^\circ$.

вые 1 и 2), в угловой зависимости i^s возникает принципиальное отличие от предсказываемого из соотношений Френеля понижения i^s (рис. 3, кривая 2). Эти отличия максимальны в окрестности энергии минимума в спектре P_I и заключаются в том, что фототок i^s , максимально сближаясь с i^p , обнаруживает аналогичную i^p угловую зависимость с максимумом. Сам факт проявления минимумов P_I свидетельствует о снижении потерь на отражение не только для p-, но и для *s*-волны. Такое сближение значений i^p и i^s (рис. 3, кривые 2 и 2'), естественно, приводит к тому, что коэффициент наведенного фотоплеохроизма, как и Δi , достигает своего минимума.

Для ГС с практически постоянным значением P_I в области их ФЧ (рис. 4, кривая 3) угловые зависимости фототоков i^p и i^s были такими же, как в области энергии минимума P_I для рассмотренного выше случая. Это означает, что в таких ГС условия просветления в отличие от рассмотренных выше структур удается удовлетворить в достаточно широкой спектральной области.

В заключение отметим, что максимальная азимутальная ФЧ в полученных структурах достигает 60 мА/(Вт · град) при T = 300 К, что на порядок выше известного для такого типа барьеров значения в отсутствие просветляющего покрытия [15]. К тому же в полученных ГС нанесение просветляющего покрытия позволяет реализовать узкоселективный режим фоторегистрации ($\delta_{1/2} = 20-40$ мэВ), причем ширина полосы и ее энергетическое положение контролируются параметрами ГС. Также следует указать на возможности использования поляризационной фотоэлектрической спектроскопии для диагностики готовых ГС и, соответственно, выбора необходимых технологических режимов их создания.

Список литературы

- A.M. Gabor, J.R. Tuttle, D.S. Albin, M.A. Contreras, R. Noufi, A.M. Herman. Appl. Phys. Lett., 65, 198 (1994).
- [2] H.W. Schock. Appl. Surf. Sci., 92, 606 (1996).
- [3] V.Yu. Rud', Yu.V. Rud', T. Walter, H.W. Schock. Inst. Phys. Ser., No 152 (ICTMC-11, Salford Sep., 8–12, 1997; IO Publ. Ltd., 1998)p. 971.
- [4] L.Stolt, J. Hodstrom, J. Kessler, M. Ruch, K.-O. Velthaus, H.W. Schock. Appl. Phys. Lett., 62, 597 (1993).
- [5] J.L. Shay, J.H. Wernick. Ternary Chalcopyrite Semiconductors: Growth, Electronic Properties, and Applications (Oxford, Pergamon Press, 1975).
- [6] Ф.П. Кесаманлы, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь. ФТП, 30, 1921 (1996).
- [7] G.A. Medvedkin, Yu.V. Rud'. Phys. St. Sol. (a), 67, 333 (1981).
- [8] Актуальные проблемы материаловедения, Под ред. Э. Калдиса. (М., ИИЛ, 1982) с. 76.
- [9] V. Rud', Yu. Rud', T. Walter, H.W. Schock. *Abstracts IC POLYSE'98*, 13–18.09.1998 (Schwabisch Gmünd, Germany, 1998) P. 37.
- [10] В.М. Ботнарюк, Л.В. Горчак, С.Д. Раевский, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Д.А. Щербань. ЖТФ, 68, 72 (1998).

- [11] В.М. Ботнарюк, В.В. Бельков, Ю.В. Жиляев, С.Д. Раевский, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Л.М. Федоров. ФТП, **32**, 1206 (1998).
- [12] В.Ю. Рудь. Тез. Третьей Санкт-Петербургской Ассамблеи молодых ученых и специалистов (СПБ., 1998) с. 76.
- [13] Г.С. Ландсберг. Оптика (М., Высш. шк., 1976).
- [14] И.С. Горбань. Оптика (Киів, Вища шк., 1979).
- [15] N.N. Konstantinova, M.A. Magomedov, V.Yu. Rud', Yu.V. Rud'. Jpn. J. Appl. Phys., **32-3**, 106 (1993).

Редактор В.В. Чалдышев

Greation and properties of In₂O₃/CdS/CuInSe₂ heterostructures

V.Yu. Rud', Yu.V. Rud'*

St. Petersburg State Technical University, 195251 St. Petersburg, Russia
*A.F. loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

E-mail: rudvas@uniys.hop.stu.neva.ru